INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Ciência_Iscte

Perfil Público

Aviso: [2026-11-06 01:58] este documento é uma impressão do portal Ciência_Iscte e foi gerado na data indicada. O documento tem um propósito meramente informativo e representa a informação contida no portal Ciência_Iscte nessa data.

Muhammad Awais

Assistente de Investigação
Instituto de Telecomunicações - IUL



Contactos

E-mail	Muhammad_Awais@iscte-iul.pt
Gabinete	D0.06.1

Total de Citações

Web of Science®	1
Scopus	1

Publicações

• Revistas Científicas

- Artigo em revista científica

1	Awais, M., Postolache, O. A. & Oliveira, S. M. (N/A). Graph-based contrastive learning for self-supervised semiconductor wafer defect detection. Journal of Intelligent Manufacturing, N/A. https://doi.org/10.1007/s10845-026-02906-3 - N.º de citações Web of Science®: 1 - N.º de citações Scopus: 1 - N.º de citações Google Scholar: 2

2	Awais, M., Postolache, O. A. & Oliveira, S. M. (2026). Quantum-enhanced learning: Leveraging von Neumann entropy for enhanced graph neural network performance. Neural Networks, 201. https://doi.org/10.1016/j.neunet.2026.108958